



Conduction Par Pieges Dans Les Films Minces de Dioxyde de Silicium

By Stéphane Burignat

Editions Universitaires Europeennes. Paperback. Condition: New. 268 pages. Dimensions: 8.7in. x 5.9in. x 0.6in. Le marché des mémoires non volatiles grille flottante connaît un essor considérable du fait de leur utilisation croissante dans tous les domaines d'applications de la microélectronique et par conséquent dans de très nombreux secteurs industriels. Cependant, ces dispositifs mémoires se heurtent à une limite technologique liée à l'impossibilité de réduire l'épaisseur de la couche d'oxyde tunnel isolant la grille flottante contenant l'information, sans atteindre le domaine des courants de fuite induits (Stress Induced Leakage Current). Ces fuites engendrent des pertes de charge qui diminuent drastiquement le temps de rétention et la durée de vie des cellules mémoires. À travers ce livre riche en détails techniques et scientifiques, l'auteur aborde successivement les nombreuses étapes indispensables qui doivent être prises en compte lors du développement d'outils de caractérisation adaptés à la mesure des courants SILC inférieurs au fA. Il explique également, en les justifiant, chaque étape de la construction d'un modèle de conduction assisté par des pièges situés dans l'oxyde de grille et permettant de rationaliser l'extraction des profils spatiaux et énergétiques de ces défauts. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg, OR, La Vergne, TN. Paperback.



READ ONLINE
[2.65 MB]

Reviews

It is straightforward in read through preferable to fully grasp. It is really simplistic but excitement in the 50 percent of the pdf. Your life span will be enhance once you comprehensive looking at this pdf.

-- **Jorge Hammes**

Thorough manual for pdf lovers. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.

-- **Kaycee McGlynn**